

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре (25 ± 10)° С			
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}	-	0,01
Выходное напряжение высокого уровня, В	U_{OH}	9,99	-
Входной ток низкого уровня и высокого уровня, мкА	I_{IL} I_{IH}	-	0,05
Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_o = 0,5$ В	I_{OL}	0,9	-
Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_o = 9,5$ В	I_{OH}	0,5	-
Ток потребления, мкА	I_{cc}	-	10,0
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, при: $C_L = 50$ пФ	t_{PHL} t_{PLH}	-	230
Остальной режим измерения при: $U_{cc} = 10,0$ В Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - золото - серебро Цветных металлов не содержится.			

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (T_{nm}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: $U_{cc}=5410$ В; $C_L \leq 500$ пФ; $U_{cc}10,2$ В / U_I / минус 0,2 В – 120000ч.

Гамма-процентный ресурс (T_{γ}) микросхем при $\gamma=95\%$ 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем ($T_{см}$) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.150 - 18 ТУ; а микросхем с индексом "ОСМ" - АЕЯР.431200.150 -18 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.